

# 三次元画像計測装置

物体の表面形状を捉える。

## 概要

本装置は、格子投影位相シフト法を応用し、静止している物体表面の高さ計測を高精度で行うことを可能にしました。測定対象となる領域のすべての画素のデータを一度に測定することができるので、立体形状の測定や、微小凹凸の高さ測定、三次元モデリングなどに応用することができます。

## 特長

- ▼ 静止物体表面の凹凸を高精度に測定
- ▼ 工業製品などの形状測定や検査に応用が可能
- ▼ 三次元解析画像表示 (Solid・Wireframe・Point)
- ▼ 解析画像は任意の方向に回転・拡大・縮小表示が可能
- ▼ 視野 10mm ~ 120mm 内の画素の高さデータを測定
- ▼ 高さ測定精度 視野の 1/1000
- ▼ 平面測定分解能 視野の 1/768
- ▼ 測定時間 1.5 秒

## 仕様

視野	10mm ~ 120mm 設計変更によりこの範囲以外でも対応可能。要相談。
高さ測定精度	視野の約 1/1000
平面測定分解能	視野の 1/768
計測時間	1.5 秒
光学測定ヘッド部	200mm (W) × 300mm (H) × 140mm (D)

